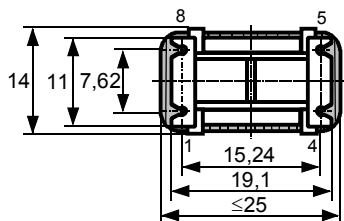


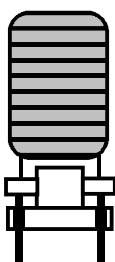
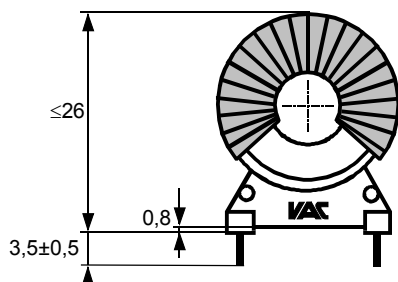
K-Nr.: Speicherdrossel / Storage Choke Datum: 05.11.2002
 K-no.: Date:

 Kunde: Typenelement / Standard Type Kd. Sach Nr.: Seite 1 von 1
 Customer Customers part no.: Page of

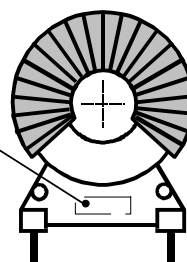
 Maßbild (mm): Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c
 Mechanical outline General tolerances

 Anschlüsse:
 Connections:

 Cu-verzinkt \varnothing 0,63 mm
 Cu-tinned

 Toleranz der Stiftabstände $\pm 0,3$ mm
 (Tolerances grid distance)

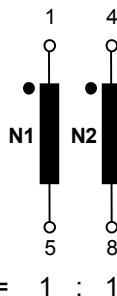
 DC = Date Code
 F = Factory

 Beschriftung:
 (marking)

DC F


 Beschriftung:
 marking

6161X001

DC F

 Anschlußschema:
 Schematic diagram

 Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte):
 Operational data/characteristic data (nominal values):

 $I_N = 2 \text{ A}$ $L = 224 \mu\text{H}$ (N1+N2 in Reihe/series)

 $I_N = 4 \text{ A}$ $L = 56 \mu\text{H}$ (N1+N2 parallel)

 $\Delta I = 0,2 \cdot I_N$
 $f \leq 200 \text{ kHz}$ $\tau_{\text{max}} \geq 0,25$

 Umgebungstemperatur/ambient temperature: $-40 \text{ }^\circ\text{C} \dots +60 \text{ }^\circ\text{C}$

 Lagertemperatur/storage temperature: $-40 \text{ }^\circ\text{C} \dots +85 \text{ }^\circ\text{C}$

 Prüfung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1)
 Inspection

- | | | | | | |
|---------------|--------|---|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1) (V) | M3014: | $U_{p,\text{eff}} = 0,5 \text{ kV}$, | 1 s, | N1 gegen/to N2 | |
| 2) (AQL 0,25) | M3214: | $L = 224 \mu\text{H} + 25\% - 10\%$, | $I_{\text{DC}} = 2 \text{ A}$, | $f = 100 \text{ kHz}$, | $U_{\text{AC,eff}} = 250 \text{ mV}$ |
| | | (N1+N2 in Reihe/series) | | | |
| 3) (AQL 1/54) | | $R_{\text{Cu1}} = R_{\text{Cu2}} \leq 69 \text{ m}\Omega$ | | | |
| 4) (AQL 1/54) | M3029: | Lötbarkeitstest
Soldering test | | | |

 Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur
 Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature

 Weitere Vorschriften: Anschlußsträger UL-gelistet
 Applicable documents: Terminal UL-listed

Datum	Name	Index	Änderung
05.11.02	Se.	80	Beschriftung umgestellt
19.05.98	Ul.	80	Maßbild, Betriebsdaten aktualisiert. Beschriftung geändert. Endprüfung Pkt.1), Prüfzeit auf 1s reduziert

Hrsg.: KB-FB FT editor	Bearb: Se. designer	KB-PM B: Kei check	freig.: Se. released
---------------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9